

全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2022]25号

关于召开《再生锗原料》等6项半导体材料标准 网络工作会议的通知

各标委会委员、各起草单位及会员单位：

根据国家标准化管理委员会下达的关于标准制修订计划的文件精神，以及2022年标委会工作安排，现定于2022年10月31日~11月1日召开半导体材料标准网络工作会议。现将有关事宜通知如下：

一、会议内容和资料

会议将对《再生锗原料》等6项半导体材料标准进行审定，具体项目见附件。请各标准项目的负责起草单位、参加起草单位和相关单位派代表参加会议。各标准负责起草单位务必于10月26日前将标准稿件等发至标委会秘书处邮箱（tc203sc2@cnsmq.com），由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于10月28日之后在有色标准信息网（www.cnsmq.com）“标准制定工作站”栏目下载。

二、会议时间

2022年10月31日上午9:00开始。

三、会议参加方式

参会人员可在“腾讯会议”软件界面，点击“加入会议”，输入会议ID及“个人姓名-单位”，点击“加入”，参加会议。

会议 ID 见附件。

四、联系方式

标委会秘书处：李素青 010-62565659 15652368697。

附件：审定项目表

二〇二二年十月十八日



抄报：全国半导体设备和材料标准化技术委员会

附件：

审定项目表

序号	计划文号及编号	项目名称	牵头单位	备注	会议 ID
1	国标委发[2021]19号 20211951-T-469	再生锗原料	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	审定	985-9163-4148
2	国标委发[2021]19号 20211954-T-469	半导体晶片电阻率及半导体薄膜薄层电阻的测试非接触涡流法	中国电子科技集团公司第四十六研究所	审定	
3	国标委发[2021]19号 20211955-T-469	硅单晶中碳、氧含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法	青海芯测科技有限公司	审定	
4	国标委发[2020]48号 20203728-T-469	碳化硅外延片表面缺陷的测试 激光散射法	安徽长飞先进半导体有限公司	审定	
5	国标委发[2020]53号 20204893-T-469	碳化硅外延层厚度的测试 红外反射法	安徽长飞先进半导体有限公司	审定	